表面プラズモン共鳴近赤外分光法を用いたアラキン酸 LB 膜の屈折率と構造の研究

(関西学院理工) 小原一朗,池羽田晶文,平野義明,尾崎幸洋

【序】 我々が独自に開発した表面プラズモン共鳴近赤外分光法(Surface Plasmon Resonance Near InfraRed 以下 SPR-NIR)¹⁾を用いてLangmuir-Blodgett(LB)膜の屈 折率について調べた.開発した SPR-NIR 分光法は全反射吸収(ATR)法に基づく Kretschmann 配置であるため金表面近傍のわずか数百 nm ~ 数mm 領域の情報を得る ことが可能である.一般に LB 膜の屈折率は分子配向があるため複屈折を考慮する必 要がある²⁾.今回,我々は近赤外領域における屈折率の分子配向依存性についてアラ キン酸 LB 膜を用いて調べた.

【実験】 アラキン酸 LB 膜を累積条件,表面圧
25 mN/m,基板昇降速度 5 mm/min,ただし,第一層目は 3 mm/min,垂直浸漬法により作成した.図1に示すように金薄膜を真空蒸着したガラス基板(n_D=1.517)に
LB 膜を累積し,内部反射するように配置したプリズム上にその基板を置いた.金薄膜の厚さは16.5 nm であった.プリズムとFT-NIR分光器を光ファイバで接続した.
光の入射角度は46.0~59.0°の範囲で0.05°おきに変



図 1: プリズム近傍の配置図,H: 加熱装置,R:スペーサー,G:金薄 膜,SL:ガラス基板,P:偏光子

化させた. 偏光子を用いて NIR 領域における吸収スペクトル測定を行った.s 偏光成 $\Im(I_{\mu})$ と p 偏光成分 (I_{μ}) で吸光度 A_{E} を次のように定義した.

$$A_E = -\log\left(\frac{I_\perp}{I_{//}}\right) \tag{1}$$

同様に金蒸着をしない基板で LB 膜の ATR 測定を行った.また,基板を 100 5分間加熱をした後,同様の測定を行った.

【結果と考察】 図 2(A)はアラキン酸 101 層累積膜の SPR-NIR(実線)と ATR(破線) 測定結果を示している.SPR-NIR スペクトルは角度ごとのスペクトルを重ねて表示 している.例えば太線で示した 55.0°の結果では 5200cm⁻¹に吸収が観測されるが, これらは SP による共鳴吸収ピーク(SPR ピーク)である.SPR は入射光の界面平行成 分の波数ベクトルが表面プラズモンの持つ波数ベクトルと一致するときに起きるの で,入射角度の変更によって共鳴波数を変化させることが可能である.また,SPR ピ ークが試料の吸収帯と重なると,SPR ピークが変調を受け,見かけ上吸収スペクトル

が増強される場合がある.図 2(A)の結果 では,入射角度の変更に伴う SPR ピークの 高波数シフトは見て取れるが 試料の吸収の 増強は見られなかった.加熱後のSPR-NIR 測定結果を図 2(B)に示す.加熱により SPR ピークは強度が下がり,低波数シフトした. また SPR ピークの幅は広くなった.図 2(C) の ATR 測定結果は図 2(A), (B)の破線スペ クトルを拡大したものであり、上に加熱前、 下に加熱後の角度 55.0°における ATR スペ クトルをそれぞれ示す 加熱前後ともに試料 の吸収が下向きに観測された これらは基板 平面に対してほぼ平行な膜面内にある吸収 がs偏光成分で強く得られたことを示唆し, SPR-NIR スペクトルにおいて試料の吸収の 増強が観測されなかったことと対応する.

共鳴波数の関数として共鳴角 _{spr} が求ま れば次式から屈折率を求められる³⁾.

$$\tilde{n}_{s} = \sqrt{\frac{n_{m}^{2} n_{p}^{2} \sin^{2} \theta_{spr}}{n_{m}^{2} - n_{p}^{2} \sin^{2} \theta_{spr}}}$$
(2)

ここで *ñ_s*, *n_m*, *n_p* はそれぞれ試料,金属, プリズムの屈折率を表す.この式で求めた結 果を図3に示した.4000-6000cm⁻¹の近赤外



図 2: 加熱前後の SPR-NIR と ATR 測定結果, (A)加熱前,(B)加熱後,(C)(A)と(B)中の破線で 示した ATR スペクトルの拡大図



領域においてアラキン酸 LB 膜 101 層の屈折率は 1.2 程度であった.また加熱により LB 膜の屈折率が 0.2 程度上昇した.これは LB 膜の配向の乱れを示唆する.式(2)は 金薄膜の厚さ依存性を含まない近似式であり,特に高波数側で実際の屈折率より値が 大きく見積もられている可能性がある.式(2)を改良した,金薄膜の厚さの影響を補正 した式を検討中である.

【参考文献】

- 1) A.Ikehata, T. Itoh, and Y. Ozaki, Anal. Chem. , 76 , 6461 , 2004 .
- 2) K. B. Blodgett and I. Langmuir, Phys. Rev., 51, 964, 1937.
- 3) E . Kretschmann and H . Reather , Z . Naturforsch . , 23 a , 2135 , 1968 .